

SPECTROSCOPIE DE PHOTOÉLECTRONS X (XPS)

FABRICANT : VG Scientific

MODÈLE : Escalab MkII

Analyses

- Appareil multisegment ayant un système à ultra-haut vide
- Analyse de surfaces couplant 4 techniques de caractérisation : Spectroscopie de photoélectron X (XPS), Spectrométrie de masse à ionisation secondaire (SIMS), Ion Scattering Spectroscopy (ISS), Microscopie Auger à Balayage (ASM)

Caractéristiques

- Source double Mg-Al
- Analyseur hémisphérique de grand rayon
- Détection monocanal
- Résolution de 0.88 eV sur l'argent
- Réacteur de haute température et de haute pression intégré

MODES

SIMS

- Fabricant : SIMSLAB
- Modèle : MM12-12S
- SIMS-Ar et SIMS-Ga à balayage basé sur un quadripôle de grande dimension
- Résolution de masse : 1 uma (sur un domaine de 1 uma à 800 uma)
- Résolution spatiale : 100 μm (Ar+) et 1 μm (Ga+)

ISS

- Modèle : VG ISS
- Résolution : 1% avec He 1000 eV (Au)

ASM

- Modèle : MicroLab500
- Canon LEG 500 de 30 keV
- Résolution spatiale : 1 μm